ИНСТИТУТ ФИЗИКИ им. Л. В. КИРЕНСКОГО СО РАН ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИИ РАН

Препринт № 816Ф

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛ ФУЛЛЕРЕНА И ФУЛЛЕРЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В ИОНИЗИРОВАННОМ УГЛЕРОДНОМ ПАРЕ

Г.Н. Чурилов, А.С. Федоров, П.В. Новиков, А.С. Алиханян, М.И. Никитин, Г.А. Глущенко, Н.В. Булина, А.Л. Емелина, Н.Г. Внукова

Красноярск – 2002

УДК 542.91: 537.525.1: 546.261

Чурилов Г.Н., Федоров А.С., Новиков П.В., Алиханян А.С., Никитин М.И., Глущенко Г.А. Булина Н.В., Емелина А.Л., Внукова Н.Г.

Основные закономерности и механизмы процесса формирования молекул фуллерена и фуллереновых производных в ионизированном углеродном паре: Препринт № 816Ф. – Красноярск: Институт физики СО РАН, 2002. – 32 с.

В работе теоретически исследовано влияние концентрации электронов на образование фуллерена C_{60} в ионизованном углеродном паре. Определены оптимальные параметры синтеза (температура и концентрация электронов), при рассмотрении образования молекулы C_{60} в одну или две промежуточные стадии столкновения углеродных кластеров. Показано, что волны концентрации электронов в плазме меняют скорость образования фуллерена C_{60} . Впервые показана не только управляющая роль электронной концентрации в образовании фуллеренов и фуллереновых производных, но и механизм этого управления. Развитые в работе концепции позволили определить условия эффективного получения гетерофуллерена с бором. Впервые был синтезирован борозамещенный фуллерен C_{59} В в макроскопических количествах. Его содержание в фуллереновой смеси составило более 11% по результатам массспектроскопических исследований.

The influence of electron concentration in ionized carbon vapor on C_{60} fullerene formation was theoretically investigated. By considering C_{60} molecule assembly at one or two intermediate stages of cluster collision we determined the plasma parameters (temperature and electron concentration) optimal for the fullerene synthesis. It was shown that waves of electron concentration in plasma changed the rate of C_{60} fullerene assembling. At the first time the important role of electron concentration for synthesis of fullerenes and their derivatives was shown. Also a mechanism of influence of electron concentration and temperature to the fullerene synthesis was proposed. Conceptions developed in the work allowed to define conditions of efficient synthesis of boron doped heterofullerene $C_{59}B$. This heterofullerene was synthesized in macroscopic quantities firstly. By results of mass-spectroscopic study it was determined that $C_{59}B$ content in fullerene mixture was more than 11%.

Рецензент доктор физико-математических наук, профессор С.Г. Овчинников

> © Институт физики им. Л. В. Киренского СО РАН

ВВЕДЕНИЕ

Ранее нами было показано, что электронная концентрация, также как и ее колебания, наряду с температурой, являются основными параметрами, определяющими синтез фуллеренов в ионизованном углеродном паре [1, 2]. Для того, чтобы понять механизм этого влияния, необходимо рассмотреть процессы, происходящие в плазме более детально.

В остывающей углеродно-гелиевой плазме образуются углеродные кластеры. Как молекулы углерода, так и углеродные кластеры характеризуются сродством к электрону и потенциалом ионизации. Кластеры в плазме заряжаются и мы должны рассчитывать процесс образования молекулы фуллерена и вообще рост кластеров не только из нейтральных, но и из заряженных, как положительно, так и отрицательно, частиц углерода.

1. Влияние зарядов углеродных кластеров на процесс образования из них молекулы фуллерена

Мы провели расчеты энергии образования молекулы фуллерена из углеродных кластеров при различной величине их заряда с использованием программы HyperChem 5.2, позволяющей рассчитывать оптимальную геометрию молекул и их полную энергию образования. Расчеты проводились полуэмпирическим методом РМЗ. Были сделаны оценки энергии образования различных углеродных кластеров для температуры 2500 К. После расчета полной энергии для различных кластеров, энергия реакции их слияния может быть подсчитана следующим образом:

 $C_n + C_m \rightarrow C_{n+m}$, $\Delta E = E_t(C_{n+m}) - E_t(C_n) - E_t(C_m)$,

Здесь ΔE – энергия химической реакции слияния, $E_t(C_i)$ – рассчитанная полная энергия кластера C_i .

Рассматривалось влияние заряда кластеров на процесс их образования. Были рассмотрены реакции как с плоскими кластерами, состоящими только из шестиугольников, так и со сфероидальными, в которых присутствует хотя бы один пятиугольник.

Сделанные оценки показали, что образование сфероидальных кластеров при 2500К более выгодно, чем плоских с тем же количеством атомов. Энергии реакций растут с увеличением

размера образующегося кластера (табл. 1, 2, рис. 1). Для плоских кластеров понижение энергии с ростом числа атомов происходит Табл. 1. Энергии реакций образования сфероидальных и плоских кластеров из более мелких.

Реакция	Сфероидальные кластеры, ∆Е, эВ	Плоские кластеры, ∆Е, эВ
$C_4 + C_{14} \rightarrow C_{18}$	-7.2	-6.1
$C_2 + C_{18} \rightarrow C_{20}$	-12.3	-11.1
$C_{20} + C_{20} \rightarrow C_{40}$	-14.2	-12.1
$C_{20} + C_{40} \rightarrow C_{60}$	-44.5	-17.9

Табл. 2. Энергии связи различных кластеров, рассчитанные методом РМЗ для температуры 2500К.

E _p , eV	Плоские маленькие кластеры				Сфе	ероидалы	ные клас	геры
заряд	C ₂	C_4	C ₁₀	C ₁₄	C ₁₈	C ₂₀	C ₄₀	C ₆₀
+1	6.40	-8.23	-48.75	-70.05	-96.8	-108.4	-239.9	-395.43
0	-4.15	-17.74	-55.67	-78.85	-103.8	-115.3	-244.8	-404.57
-1	-8.11	-21.41	-60.08	-81.21	-108.8	-120.2	-251.6	-407.55
-2	0.66	-16.73	-57.78	-79.92	-103.5	-119.3	-251.8	-411.86
					Плоские	кластерь	I	
+1	1///	/////	/////	////	-93.82	-107.75	-239.47	-375.99
0					-102.65	-117.86	-247.84	-383.57
-1	1///				-104.71	-120.73	-249.38	-385.61
-2	////		/////		-105.32	-118.82	-250.27	-374.93

медленнее. Этот вывод объясняется ростом числа атомов углерода с ненасыщенными связями для плоских кластеров. С другой стороны этот вывод позволяет говорить о правомерности оценок, сделанных с помощью метода РМЗ.

Энергия реакции $C_n + C_m \rightarrow C_{n+m}$ образования кластера C_{n+m} существенно зависит от зарядов реагирующих частиц (табл. 3). В таблице представлены энергии реакций образования: фуллерена C_{60} , плоского кластера C_{60} , плоских и сфероидальных кластеров C_{40} и C_{20} . Все эти реакции образования сфероидальных и плоских кластеров проиллюстрированы на рис.1, А и В, соответственно.

В целом наиболее выгодными являются реакции «нейтралион» и «анион-катион». Реакции между нейтральными кластерами менее выгодны. Наименее выгодны реакции между одноименно заряженными ионами, хотя они вряд ли возможны, так как практически всегда энергия кулоновского отталкивания превосходит тепловую энергию молекулы kT.



Рис. 1. Реакции образования сфероидальных (А) и плоских (В) кластеров. Энергии реакций приведены в таблице 1.

Табл. 3.	Зависимость эне	ргии реакции ΔΕ	(эВ) от	зарядов	реагирующих	кластеров,
сфероид	дальных (А) и плосн	ωх (В).				

Тип	Реакция	C ₆₀		C ₄₀		C ₂₀	
реакции	Геакция	Α	В	Α	В	А	В
Нейтрал - Ион	$C_n^0 + C_m^- \to C_{n+m}^-$	-42.6	-18.4	-16.1	-10.8	-8.3	-11.9
	$C_n^0 + C_m^+ \to C_{n+m}^+$	-42.2	-28.1	-16.2	-13.9	-11.0	-11.5
Анион - Катион	$C_n^- + C_m^+ \to C_{n+m}^0$	-44.6	-23.4	-16.2	-19.4	-10.4	-15.9
Нейтрал - Нейтрал	$C_n^0 + C_m^0 \to C_{n+m}^0$	-44.5	-17.9	-14.2	-12.1	-7.4	-11.1

Для более мелких кластеров в целом картина аналогична случаю плоского кластера С₆₀: наиболее выгодными являются реакции «нейтрал-ион» и «анион-катион», наименее выгодными – «анион-анион» и «катион-катион». Необходимо отметить, что

приведенные энергии реакций рассчитаны без учета кулоновского взаимодействия и эффектов поляризации. Однако, даже по этим данным можно сказать, что с точки зрения термодинамики реакции с участием заряженных частиц возможны и даже, как правило, более выгодны.

Интересные результаты получены при анализе влияния заряда кластера на его геометрию и стабильность. Сферически замкнутая молекула фуллерена C₆₀ сохраняет свою структуру вне зависимости от его заряда. Плоский же кластер C₆₀ ведет себя поразному.



Рис.2. Поведение мелких кластеров с различным зарядом при минимизации энергии.

Нейтральный кластер С₆₀ и однозарядный анион С₆₀¹⁻ сворачиваются в фрагмент сферической поверхности и остаются стабильными при 2500 К. Сворачивание происходит в местах, где два шестиугольника разделены недостроенным шестиугольником, имеющим четыре связи. В этом месте образуется пятая связь и благодаря появлению пятиугольника кластер начинает сворачиваться. Наиболее важный вопрос в модели образования фуллеренов это образование пятиугольника. В отличие от шестиугольника, пятиугольник из атомов углерода - это фигура напряженная. Обычно он возникает, если его можно стабилизировать какими либо атомами, например водородом. При синтезе фуллеренов кроме атомов углерода и инертного газа в плазме ничего нет. На примере кластера С₁₈, в котором присутствует один незавершенный пятиугольник, можно проследить изменение его геометрии в зависимости от его заряда (рис. 2). При нахождении оптимальной геометрии однозарядных ионов C_{18}^{1-} и C_{18}^{1+} образуется пятиугольник, а при оптимизации геометрии нейтрального кластера расстояние между крайними шестиугольниками наоборот увеличивается. Оптимизация геометрии, проведенная для различных кластеров C_k (k = 22 – 26), показала, что сфероидальные кластеры образуются и из нейтральных кластеров. При любой концентрации электронов в плазме идет образование сфероидальных кластеров, которые могут достраиваться до молекулы фуллерена.

Интересно было рассмотреть процесс эволюции кластеров в зависимости от величины электронной концентрации, в свете полученных результатов на основании проведенных нами расчетов. Оказалось, что при возрастании концентрации электронов крупные плоские кластеры приобретают отрицательный заряд и сворачиваются в элементы сфероидальной поверхности. Однажды образовавшись, эти кластеры остаются стабильными. Экспериментальные результаты подтверждают стабильность фуллеренов даже при заряде 6е.

В рассмотренных нами реакциях образования молекул фуллеренов для заряженных коагулирующих кластеров не учитывалась энергия кулоновского взаимодействия и не учитывались статистические процессы, но и в этом подходе показано, что заряд существенно влияет на энергетику образования фуллеренов и очевидна управляющая роль электронной концентрации.

2. Оценки скорости образования фуллерена С₆₀ в зависимости от параметров углеродно-гелиевой плазмы

Мы рассмотрели зависимость формирования фуллерена С₆₀ от таких параметров плазмы, как температура и концентрация электронов. Из возможных путей сборки фуллерена были выбраны 2 пути (А,Б) сборки из углеродных кластеров, состоящих из пятиугольников и шестиугольников.





Для каждого кластера *C_k* с зарядами q= -2, -1, 0, +1 методом псевдопотенциала из первых принципов были вычислены энергии связи.

Из разностей энергий связи нейтральных и заряженных кластеров вычислялись потенциал ионизации E_i, сродство к электрону EA₁ и второе сродство к электрону EA₂. Остальные потенциалы не рассматривались, т.к. они являются слишком большими, чтобы соответствующие ионы могли существовать в плазме при рассматриваемых температурах. Физический смысл этих трех величин есть энергия, затраченная на отрыв электрона от нейтрального кластера и энергия, выделяющаяся при присоединении к нейтральному кластеру одного или двух электронов:

$$C_{k} + E_{i} \rightarrow C_{k}^{1+} + e$$

$$C_{k} + e \rightarrow C_{k}^{1-} + EA_{1}$$

$$C_{k} + 2e \rightarrow C_{k}^{2-} + EA_{2}$$
(1)

В таблице 4 приведены значения энергия связи E_b^0 нейтральных кластеров, потенциал ионизации E_i , сродство к электрону EA₁ и к двум электронам EA₂, рассчитанные методом псевдопотенциала с помощью программы VASP 4.4.3.

Табл. 4. Значения энергия связи (E_b⁰), потенциала ионизации (E_i), сродство к электрону (EA₁) и к двум электронам (EA₂) нейтральных кластеров.

Кластер	E _b ⁰ , eV	E _i , eV	EA ₁ , eV	EA ₂ , eV
C ₂	-8.9	11.67	4.75	6.31
C ₂₀	-149.8	7.2	3.8	5.152
C ₄₀	-314.4	5.6	4.0	7.66
C ₆₀	-495.6	4.8	3.6	6.0

3. Средний заряд частиц в плазме в условиях термодинамического равновесия

Рассмотрим в качестве источника фуллерен-образующей плазмы дуговой разряд. Будем считать, что параметры плазмы в той области, где образуются фуллерены, не сильно отличаются от параметров дуговой плазмы. Поэтому можно считать, что углеродно-гелиевая плазма, в которой образуются фуллерены, находится в условиях локального термодинамического равновесия [3]. Тогда для расчетов зарядов ее компонент применимы уравнения Саха.

Для заданной концентрации электронов n_e и температуры T вероятности для каждого кластера C_k иметь заряд 0, +1, -1 и -2 определяются из уравнений Саха для соответствующих компонент:

$$\frac{p_{k}(+1) \cdot n_{e}}{p_{k}(0)} = \frac{Z_{k}^{+1}}{Z_{k}^{0}} a \exp(-E_{i}/k_{B}T)$$

$$\frac{p_{k}(0) \cdot n_{e}}{p_{k}(-1)} = \frac{Z_{k}^{0}}{Z_{k}^{-1}} a \exp(-EA_{1}/k_{B}T) , \qquad (2)$$

$$\frac{p_{k}(-1) \cdot n_{e}}{p_{k}(-2)} = \frac{Z_{k}^{-1}}{Z_{k}^{-2}} a \exp(-(EA_{2}-EA_{1})/k_{B}T)$$

где коэффициент $a = 2 \left(m_e kT / 2 \pi \hbar^2 \right)^{3/2}$ и $Z_k^q(T) = \sum_{k=1}^{n_{max}} a_k \exp\{ -(c_k - c_k)/k T \}$ – статистическая сумма для

 $=\sum_{n=1}^{n_{\max}} g_n \exp\{-(\varepsilon_n - \varepsilon_1)/k_BT\}$ – статистическая сумма для кластера *C_k* с зарядом *q* для данной температуры *T*.

Через вероятность $p_k(0)$ того, что кластер C_k имеет нулевой заряд, вероятности обнаружить кластер с зарядами +1, -1, -2 выразятся как

$$p_{k}(+1) = p_{k}(0) \cdot \frac{Z_{k}^{+1}}{Z_{k}^{0}} \cdot \frac{a}{n_{e}} \exp(-E_{i}/k_{B}T)$$

$$p_{k}(-1) = p_{k}(0) \cdot \frac{Z_{k}^{-1}}{Z_{k}^{0}} \cdot \frac{n_{e}}{a} \exp(EA_{1}/k_{B}T)$$

$$p_{k}(-2) = p_{k}(0) \cdot \frac{Z_{k}^{-2}}{Z_{k}^{0}} \cdot \left(\frac{n_{e}}{a}\right)^{2} \exp(EA_{2}/k_{B}T)$$
(3)

Введем условие нормировки вероятностей $p_k(-2) + p_k(-1) + p_k(0) + p_k(+1) = 1$. Если теперь мы зададим некоторую концентрацию кластера n_k , то равновесные концентрации этого кластера с различными зарядами q будут равны

 $n_k(q) = n_k \cdot p_k(q), \quad q = -2, -1, \ 0, \ +1$ (4)

Средний заряд кластера *С_k* при данной концентрации электронов *n_e* и температуре *T* будет равен

$$\langle q_k \rangle = \frac{\sum_{q=-2}^{+1} q n_k(q)}{\sum_{q=-2}^{+1} n_k(q)} = \frac{1}{n_k} \cdot \sum_{q=-2}^{+1} q n_k(q)$$
(5)

4. Сечения столкновений кластеров и вероятность образования фуллеренов

Расстояние наибольшего сближения классических частиц r_0 связано с прицельным параметром ρ соотношением

$$1 - \frac{\rho^2}{r_0^2} = \frac{q_1 q_2 e^2}{r_0 \varepsilon} , \qquad (6)$$

где ε – энергия столкновения в системе центра инерции, q_1 и q_2 – заряды частиц.

Если проинтегрировать это выражение по всем $r_0 \leq r_{12} = r_1 + r_2$, где г₁ и г₂ – радиусы частиц, то получим сечение столкновения двух заряженных частиц с зарядами q_1 и q_2 :

$$\sigma_{12} = \sigma_0 \left(1 - \frac{q_1 q_2 e^2}{r_{12} \varepsilon} \right), \tag{7}$$

где $\sigma_0 = \pi r_{12}^2$ – сечение столкновения двух классических частиц с нулевым зарядом, $q_1 q_2 e^2 / r_{12} \varepsilon = E_{12}$ – отношение кулоновской энергии и средней кинетической энергии взаимодействующих частиц.

Усредняя кинетическую энергию движения молекул, с учетом максвелловского распределения скоростей, получим, что

$$\varepsilon = 3/2 \cdot k_{\rm B}T$$
.

Если заряды разноименные, то $q_1 q_2 < 0$ и выражение в скобках формулы (7) будет больше 1, т.е. $\sigma_{12} > \sigma_0$. Если же $q_1 q_2 > 0$ в случае одноименных зарядов, то сечение $\sigma_{12} < \sigma_0$. Если энергия кулоновского отталкивания больше средней тепловой энергии кластеров ($E_{12} / \varepsilon > 1$), то частицы будут отталкиваться, в этом случае $\sigma_{12} = 0$. При этом мы предполагаем, что любое столкновение двух кластеров C_k и C_m ведет к образованию кластера С_{км}.

Рассмотрим один тип столкновений, в котором кластер C_m обладает зарядом q_m , а кластер C_k обладает зарядом q_k . Скорость образования заряженного кластера C_{k+m}^{s+q} будет равна

 $R_{km}(q_k, q_m) = n_m(q_m) \cdot n_k(q_k) \cdot v_{km} \sigma_{km}(q_k, q_m),$ (8) где $n_m(q_m), n_k(q_k)$ – концентрации q_m -ой и q_k -ой компонент кластеров C_m и C_k , соответственно, $v_{km} = \sqrt{8k_B T / \pi m_{km}}$ – скорость относительного движения, $m_{km} = m_k m_m / (m_k + m_m)$ – приведенная масса кластеров C_k и C_m .

Чтобы получить полную скорость образования кластера C_{k+m} из кластеров C_m и C_k при данной температуре и электронной концентрации необходимо просуммировать скорость образования по всем заряженным компонентам кластеров C_k и C_m

$$R_{km} = \sum_{q_m = -2}^{+1} \sum_{q_k = -2}^{+1} n_m(q_m) \cdot n_k(q_k) \cdot \mathbf{v}_{km} \sigma_{km}(q_m, q_k).$$
(9)

Поскольку концентрации заряженных компонент пропорциональны вероятности их образования при данной температуре и электронной концентрации (4) и не зависят от зарядов, то за знаки сумм можно вынести полные концентрации кластеров и скорость относительного движения:

$$R_{km} = n_m n_k \mathbf{v}_{km} \cdot \sum_{q_m = -2}^{+1} \sum_{q_k = -2}^{+1} p_m(q_m) \cdot p_k(q_k) \cdot \sigma_{km}(q_m, q_k) =$$

$$= R_{km}^0 \cdot \sum_{q_m = -2}^{+1} \sum_{q_k = -2}^{+1} p_m(q_m) \cdot p_k(q_k) \cdot \left(1 - \frac{q_m q_k}{r_{km} \varepsilon}\right)$$
(10)

где $R_{km}^0 = n_k n_m v_{km} \sigma_{km}^0$ – скорость образования кластера C_{k+m} , в случае, когда кластеры C_k и C_m не заряжены.

В качестве примера в таблице 5 приведены значения величины σ_{12}/σ_0 в зависимости от зарядов q_1 и q_2 для некоторых значений q_1 и q_2 .

Табл. 5. Значения величины σ_{12}/σ_0 в зависимости от зарядов q_1 и q_2

\boldsymbol{q}_1	q ₂	$\sigma_{_{12}}/\sigma_{_0}$	$\sigma_{\scriptscriptstyle 20,40}/\sigma_{\scriptscriptstyle 0}$ при Т=4000К
0	0	1	1
+1	0	1	1
+1	+1	1 – 1/rε	0
+1	-2	1 + 2/ <i>rɛ</i>	16.17
-1	+1	1 + 1/ <i>rɛ</i>	8.59
-1	0	1	1
-1	-1	1 – 1/ <i>rε</i>	0
-1	-2	1 – 2/ <i>rε</i>	0

Сечение столкновения максимально, когда заряды разноименные, поэтому наибольшая скорость образования некоторого кластера C_{k+m} должна реализовываться в случае, когда в системе присутствует некоторая доля кластеров C_k , имеющих заряд, и некоторая доля кластеров C_m , имеющих заряд противоположного знака.

Процесс образования фуллерена C_{60} в соответствии со схемой А и Б идет путем двух реакций:

A)
$$\begin{array}{c} C_{20} + C_{20} \rightarrow C_{40} \\ C_{40} + C_{20} \rightarrow C_{60} \end{array}$$

 B) $\begin{array}{c} C_{18} + C_{40} \rightarrow C_{58} \\ C_{58} + C_2 \rightarrow C_{60} \end{array}$

Скорости образования С₄₀ и С₅₈ равны, соответственно:

A)
$$R_{40} = \frac{1}{2} n_{20}^2 v_{20,20} \sigma_{20,20}$$

 B) $R_{58} = n_{18} n_{40} v_{18,40} \sigma_{18,40}$

Коэффициент 1/2 стоит, поскольку без него каждый кластер C_{20} учитывался бы дважды. Скорость образования C_{60} зависит от скорости образования C_{40} или C_{58} соответственно:

A)
$$R_{60} = (n_{40} + R_{40}\Delta t)n_{20} v_{20,40} \sigma_{20,40}$$

b) $R_{60} = (n_{58} + R_{58}\Delta t)n_2 v_{58,2} \sigma_{58,2}$.

Для данных схем A и Б образования фуллерена была рассчитана скорость образования фуллерена C_{60} тремя способами. Во всех трех способах кроме скорости образования R_{60} для сравнения рассчитывалась скорость образования R_{60}^{0} , соответствующая схемам А и Б, но в предположении нейтральности всех кластеров.

В первом случае (рис. 3, 4) расчет проводился для постоянной температуры при различных концентрациях электронов. На рис. 2.5 приведен расчет скорости образования фуллерена C_{60} в зависимости от концентрации электронов при температуре 2500К. Пунктиром изображены значения скоростей R_{60}^0 для схем А и Б. Из рисунка видно, что максимальной скорости образования C_{60} по схеме А соответствуют концентрации электронов порядка 10^{17} м⁻³, а по схеме Б соответствует интервал концентраций электронов 10^{15} — 10^{18} м⁻³ при 2500К.



Рис. 3. Скорость образования фуллерена С₆₀ по схемам А и Б в зависимости от концентрации электронов при температуре 2500 К.



Рис. 4. Средний заряд кластеров C2, C18, C20, C40, C58 в зависимости от концентрации электронов при температуре 2500 К.

Это связано с зависимостью средних зарядов (рис. 4) кластеров от концентрации электронов и температуры. Схема А: в интервале значений концентрации электронов $10^{15}-10^{17}$ м⁻³ средний заряд кластера C_{20} меняется слабо и имеет величину, близкую к нулю, поэтому сечение столкновения близко к сечению столкновения нейтральных частиц. Схема Б: При значениях концентрации электронов порядка 10^{17} м⁻³ средние заряды кластеров C_2 и C_{58} достаточно велики и противоположны по знаку, т.е. электростатическое притяжение кластеров приводит к резкому увеличению сечения столкновений.

Во втором случае (рис. 5, 6) расчет проводился для постоянной концентрации электронов при различных температурах. На рис. 5 приведен расчет скорости образования фуллерена C_{60} в зависимости от температуры при концентрации электронов 10^{18} м⁻³. В интервале температур 2500–3500К скорость образования фуллеренов по схемам А и Б имеет резкий максимум. Он также связан с зависимостью средних зарядов кластеров от температуры (рис. 6). В этом интервале средний заряд кластера C_{20} меняется слабо и имеет величину, близкую к нулю (схема A), а заряды кластеров C_2 и C_{58} максимальны по модулю и противоположны по знаку (схема Б).



Рис. 5. Скорость образования фуллерена C_{60} по схемам А и Б в зависимости от температуры при концентрации электронов $10^{18} \, \text{m}^{-3}$.



Рис. 6. Средний заряд кластеров в зависимости от температуры при концентрации электронов 10¹⁸ м⁻³ (в зарядах электрона).

Из расчета можно сделать вывод, что при температурах образования фуллеренов, которые очевидно соответствуют переходу углеродного пара в конденсированное состояние углерода (2000 – 3000 К), отклонение концентрации электронов от оптимальной на два порядка должно приводить к резкому падению скорости образования фуллеренов, уменьшая тем самым их суммарный выход.

В третьем случае (рис. 7, 8) в зависимости от температуры концентрация электронов (рис. 9) рассчитывалась из условия квазинейтральности чистой углеродно-гелиевой плазмы без примесей. Т.е., для каждой температуры суммарный заряд электронов равнялся сумме зарядов всех углеродных кластеров и ионов гелия. При этом заряды углеродных кластеров играли основную роль в определении величины электронной концентрации, т.к. заряд гелия всегда близок к нулю из-за большого потенциала ионизации (24.58 эВ). Расход гелия в расчетах задавался 10 л/мин, скорость поступления углерода в плазму 0.17 г/мин.

В расчете мы ограничились условием, что углеродный пар состоит из кластеров размером не более 60 атомов углерода. Данные масс-спектрометрии показывают, что количество кластеров



Рис. 7. Скорость образования фуллерена С₆₀ в зависимости от температуры при самосогласованной электронной концентрации.



Рис. 8. Средний заряд всех кластеров, кластера C₂, C₂₀ и C₄₀ в зависимости от температуры при самосогласованной электронной концентрации.



Рис. 9. Зависимость электронной концентрации от температуры при самосогласованном расчете с учетом квазинейтральности плазмы.



Рис. 10. Потенциал ионизации, сродство к электрону и к двум электронам, интерполированные на диапазон кластеров от C_2 до $C_{60}.$



Рис. 11. Варианты распределения концентрации углеродных кластеров в плазме (в относительных единицах) по размерам, использованные в расчетах. Распределение А взято из работы [4]; В – распределение, соответствующее одинаковой концентрации всех кластеров; С – распределение, соответствующее большому накоплению фуллеренов.

с четным числом атомов в сотни раз превышает количество кластеров с нечетным числом атомов. Поэтому в расчете предполагалось, что углеродный пар состоит из кластеров с четным числом атомов от C_2 до C_{60} . Значения потенциалов ионизации и сродства к электрону из таблицы 4 были интерполированы на весь ряд кластеров (рис. 10). Распределение по массам данных кластеров было взято из работы [4] (рис. 11, А).

Далее для каждой температуры на основе уравнений Саха вычислялась сумма зарядов всех углеродных кластеров и гелия и из нее определялась концентрация электронов.

На рис. 7 приведены скорость образования фуллерена С₆₀ (R₁₂) в зависимости от температуры при самосогласованной электронной концентрации. Пунктиром обозначена скорость образования фуллерена С₆₀ (R₀), рассчитанная из сечения столкновений оо, не учитывающего заряды кластеров. Скорость образования R₀ растет с уменьшением температуры, поскольку давление считается постоянным. Поэтому при уменьшении температуры уменьшается занимаемый газом объем, т.е. увеличивается концентрация всех его компонент. На рис. 8 для данного расчета приведены зависимости средних зарядов кластеров от температуры (в величинах заряда электрона). На рис. 7 хорошо видно, что скорость образования фуллерена $R_{12} > R_0$, когда средние заряды реагирующих кластеров имеют разный знак. $R_{12} < R_0$, когда средние заряды совпадают по знаку, и $R_{12} \approx R_0$, когда средние заряды близки к нулю. Скорость R₁₂ образования фуллерена по схеме Б с учетом зарядов кластеров значительно превышает скорость R₀ для схемы Б без учета зарядов кластеров, т.к. на данном интервале температур средние заряды С₂ и С₅₈ всегда велики по модулю и противоположны по знаку (рис. 8). По схеме А величина R_{12} превышает менее, чем на 10% величину R_0 только вблизи температуры 4500К (рис. 7).

Видно, что во всех трех расчетах наблюдается четко выраженный максимум скорости образования фуллерена С_{60.} Чтобы получить более полную картину зависимости скорости образования фуллерена С₆₀ от температуры и концентрации электронов (рис. 12) была рассчитана суммарная скорость образования по всем одностадийным реакциям, приводящим к образованию С₆₀ при коагуляции кластеров С_k и С_m, таких, что *k*+*m*=60:

$$R_{60} = \sum_{k+m=60} n_k n_m \mathbf{v}_{km} \boldsymbol{\sigma}_{km} \,.$$



Рис. 12. Скорость образования фуллерена С₆₀ в зависимости от температуры и концентрации электронов. *1* – без учета зарядов, *2* – с учетом зарядов реагирующих кластеров.

Из рис. 12 видно, что скорость образования фуллерена C_{60} имеет характерный максимум в области температур 2500–3000К и концентрации электронов ${\sim}10^{-16}\,{\rm m}^{-3}.$

Для коагуляции кластеров различных размеров необходимы различные оптимальные значения температуры и электронной концентрации, соответствующие максимальной скорости коагуляции этих кластеров. Спектральные исследования многих авторов, например, Д. Афанасьева, И. Блинова, А. Богданова и др. [5], показали, что при синтезе фуллеренов основную роль играют молекулы С₂. Примем предположение, что основные пути сборки кластеров и фуллеренов в том числе, проходят при участии С₂. Тогда из рис. 13 видим, что скорость образования кластеров с различным числом атомов, по-разному зависит от величины электронной концентрации. Скорость образования малых кластеров максимальна при электронных концентрациях порядка 10¹⁶ м⁻³, а скорость образования больших кластеров максимальна при концентрациях порядка $10^{17} \, \text{м}^{-3}$.

Учитывая то, что оптимальные скорости реакций слияния реализуются при различных концентрациях электронов и

температуре, синтез фуллеренов будет проходить наиболее эффективно при периодическом изменении электронной концентрации, т.е., при возникновении ионизационной волны. Приведенные выше рассуждения, как и обзор методов плазменного получения фуллеренов показывают, что синтез зависит, кроме температуры и величины электронной концентрации еще и от периодического их изменения.



Рис. 13. Скорость реакции присоединения C_2 к различным кластерам в зависимости от концентрации электронов при температуре 2500 К.

Вывод о том, что заряженные кластеры должны оказывать влияние на процесс образования фуллеренов находится в согласии с экспериментальным опытом [6, 7]. Углеродные кластеры могут иметь положительный, отрицательный или нулевой средний заряд, в зависимости от величины электронной концентрации (рис. 4). При нулевом среднем заряде отрицательный член в формуле сечения столкновения равен нулю и сечение много больше, чем в случае, когда заряды кластеров имеют одинаковый знак. Самый благоприятный случай реализуется, когда заряды кластеров имеют разные знаки (табл. 5). Как следует из рис. 4 это должны быть кластеры, существенно отличающиеся по размеру.

Для случая, когда в разных областях плазмы существует разная электронная концентрация, можно обеспечить заряд разной величины даже для кластеров одинакового размера. В этом случае процессы коагуляции кластеров, т.е. образование фуллеренов, будут идти более эффективно. Получить различную электронную концентрацию в различных областях плазмы можно, обеспечив возбуждение ионизационных волн.

На рис. 14 приведен экспериментальный график для электронной концентрации температуры распределения И электронов в ионизационной волне [8]. Такая структура ионизационной волны характерна как для движущейся, так и для неподвижной волны большой амплитуды. Относительные изменения концентрации всегда в несколько раз больше относительных изменений температуры электронов. Это связано с сильной зависимостью коэффициента ионизации от Te в слабо ионизованной плазме.



Рис. 14. Изменение концентрации и температуры электронов в пределах страты.

5. Теоретические оценки образования эндоэдральных фуллеренов и гетерофуллеренов с учетом заряда кластеров

Нами было проведено исследование влияния заряда углеродных кластеров и атомов металла на образование металлофуллеренов. В качестве примера был выбран эндоэдральный комплекс Me@C₈₄ с благородными металлами Pt, Ir, 3d-металлами Fe, Ni и металлами подгруппы скандия: Sc, Y. Входными данными для расчетов являлись: расход гелия, углерода и внедряемого металла. Также задавалось начальное распределение потока углерода по кластерам различной величины. Расход веществ брался в соответствии с экспериментальными данными для установки, описанной в работе [9], и составил: гелий - 10 л/мин, углерод - 0.17 г/мин, металл - 0.05 г/мин. Было использовано несколько распределений углеродных кластеров по концентрациям для сравнения. В качестве основного было использовано распределение кластеров, теоретически полученное в [4] на основе решения уравнений кинетики.

Мы использовали один из возможных путей встраивания атома металла в молекулу фуллерена; вначале атом металла образует химическую связь с кластером С₄₂ при столкновении, далее полученный кластер MeC₄₂, сталкиваясь с другим кластером С₄₂, образует при благоприятных условиях молекулу металлофуллерена (рис. 15):

$$\begin{array}{rcl} C_{42}\text{+}\text{Me} & \rightarrow & \text{MeC}_{42}, \\ C_{42}\text{Me} + C_{42} & \rightarrow & \text{Me}@C_{84} \end{array} \tag{11}$$

Аналогично, для чистого фуллерена C₈₄ был принят следующий путь сборки из двух кластеров C₄₂:



Рис. 15. Модель сборки эндоэдрального фуллерена из двух частей.

Для диапазона температур от 1500 К до 5000 К были рассчитаны скорости образования металлофуллерена Ме@С₈₄ и фуллерена С₈₄. На рис. 16 приведены вероятности образования металлофуллерена с металлами Sc, Y, Fe, Ni, Pt, Ir для различных температур. На этом же рисунке для сравнения приведены скорости образования металлофуллеренов, рассчитанные без учета заряда (линии без маркеров), т.е. для случая, когда сечение столкновения принималось равным σ_0 .



Рис. 16. Вероятность образования эндоэдрального фуллерена Ме@Св₄ в зависимости от температуры для различных металлов. Линиями без маркеров изображены скорости образования металлофуллерена без учета зарядов.

Расчет сделан с учетом различной заряженности кластеров и металла. Проведенные расчеты показывают, что вероятность получения эндоэдральных фуллеренов со Sc намного выше чем, например, с Pt. Эти результаты совпадают с экспериментальными наблюдениями. Например, в книге И.В. Золотухина Ю.Е. Калинина и О.В. Стогней [10] уже высказывалась идея о том, что ионизационный потенциал металлического атома может влиять на образование металлофулерена.

Существует большой класс фуллеренов, у которых один или несколько углеродов замещены атомами другого элемента. Эти вещества называются гетерофуллеренами. Много надежд исследователи связывают с азот- и боро-замещенными фуллеренами. Однако эти вещества пока еще только обнаружены физическими методами, требующими ничтожное количество для их регистрации, например масс-спектральным методом. Это связано с тем, что не найдено способа эффективного их получения.

Проведенные нами расчеты методом псевдопотенциала и методом РМЗ подтвердили, что $C_{59}B$ - это устойчивая молекула (рис. 17). Энергия связи фуллерена C_{60} = -495.6 эВ, энергия связи $C_{59}B$ = -492 эВ., разница составляет 2.5 эВ при температуре 2100 К.



Рис. 17. Изопотенциальная поверхность борозамещенного фуллерена С₅₉В для величины электростатического потенциала E = 1.36 эВ (0.05 e/a₀). Дипольный момент d = $2.5 \cdot 10^{-30}$ Кл·м (0.75 D).

6. Синтез и исследование борозамещенного фуллерена.

Для получения борозамещенных фуллеренов мы использовали метод синтеза и установку, описанные в работе [9]. В поток углеродно-гелиевой плазмы вводился порошок B₂O₃. Оксид бора был использован в качестве допанта в соответствии с приведенной выше моделью образования фуллеренов и фуллереновых производных с учетом заряда иона. Действительно, в плазме, при температуре 6000 – 7000 К должны образовываться анионы бора и появляется реальная возможность сфероидальному кластеру провзаимодействовать с анионом бора и достроиться до гетерофуллереновой молекулы.

Полученная при таких условиях фуллеренсодержащая сажа исследовалась масс-спектральным методом (рис.18). Анализ молекулярного состава проводился на времяпролетном массспектрометре Bruker BIFLEX III с ионизацией методом лазерного пучка.

Далее было проведено экстрагирование фуллеренов из сажи бензолом. Анализ молекулярного состава образца проводился на масс-спектрометре МИ 1201, переоборудованном для высокотемпературных термодинамических исследований.



Рис. 18. Часть масс-спектра фуллереновой сажи, синтезированной при введении бора.



Рис. 19. Часть масс-спектра фуллеренового экстракта, синтезированного при введении бора. Приведено изменение спектра с ростом температуры. Звездой отмечены пики, соответствующие массе фуллерена С₅₉В.

Вещество сублимировалось из эффузионной камеры при ионизации методом электронного удара (60-80 эВ). При температурах ниже 715 К в масс-спектре были обнаружены ионы с отношением m/e = 720,721,722,723, отвечающие ионизационному составу молекулы C_{60} . Недостаточно высокое разрешение прибора не позволило зарегистрировать ионы с m/e менее 720, характерные для C_{59} В, поэтому дальнейшие измерения проводились при более высоких температурах. Это дало возможность поддерживать достаточно большие интенсивности ионных токов при уменьшении ширины входной щели электрометрического усилителя и тем самым добиться большего разрешения. Типичная картина в области масс с m/e 717-725 показана на рис. 19.

Исследования показали, что при температурах 720-790 К ионный ток $C_{59}B^+$ составляет величину, меньшую по сравнению с током C_{60}^+ . При увеличении температуры наблюдалось еще большее относительное уменьшение соотношения этих токов. Первое объясняется более низкой летучестью $C_{59}B$ по сравнению с C_{60} , второе – выгоранием $C_{59}B$ из смеси (или из твердого раствора). Найденная температурная зависимость (15) отношения ионных токов $C_{59}B^+/C_{60}^+$, оказалась прямо пропорциональна отношению давления пара $C_{59}B$ к давлению пара C_{60} (табл. 5). Это позволило оценить термодинамические параметры процесса сублимации $C_{59}B$.

$$lg(P_{C59B}/P_{C60}) = -((1.68\pm0.70)^{*}10^{3})/T + (1.85\pm0.92)$$
(15)
$$P_{C60}^{0} = (\frac{-(9154\pm150)}{T} + (8.28\pm0.2))\Pi a$$
(16)

Предполагая активности C_{59} В и C_{60} равными единице, используя зависимость (16), получим

$$\Delta_{S}H_{T}^{0}(C_{59}B) = (208 \pm 18)\frac{\kappa \mathcal{A}\mathcal{H}}{MOЛb} \qquad \Delta_{S}S_{T}^{0}(C_{59}B) = (98 \pm 18)\frac{\kappa \mathcal{A}\mathcal{H}}{MOЛb \cdot K}$$
$$\lg P_{C59B}^{0} = (\frac{-(10838 \pm 166)}{T} + (5.12 \pm 0.73)) \cdot 9,81 \cdot 10^{4} \Pi a$$

Большая энтальпия сублимации C₅₉B по сравнению с C₆₀ вполне объяснима наличием у C₅₉B дипольного момента и, следовательно, более сильным межмолекулярным взаимодействием.

m/e	lg(P _{C59B} /P _{C60})	1/T*10 ³
719	-0,495	1,391
753	-0,377	1,328
769	-0,238	1,300
770	-0,279	1,299
790	-0,299	1,266
773	-0,418	1,294
757	-0,408	1,321

Табл. 5. Логарифм отношения давления С₅₉В к давлению С₆₀ для некоторых m/e.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные расчеты энергий образования молекул фуллеренов показали, что заряд кластеров существенно влияет на энергетику образования фуллеренов. С другой стороны, величина и знак заряда кластера зависит от температуры и электронной концентрации в плазме. То, что температура является определяющим параметром плазмы при фазовом переходе углеродного пара в конденсированное состояние - факт очевидный и разработчики установок по производству фуллеренов его учитывают. Впервые нами показана не только управляющая роль электронной концентрации в образовании фуллеренов, но и механизм этого управления.

Стало понятно, почему метод синтеза фуллеренов, разработанный немецкой группой ученых под руководством В. Кретчмера остается до сих пор одним из наиболее эффективных. Углеродно-гелиевая плазма. покинув область дугового разряда. остывает при давлении 100-200 Тор. Эта область параметров плазмы отличается ионизационной неустойчивостью. Обычно при таких параметрах наблюдаются ионизационные волны. Как показывают расчеты, выполненные в рамках теории кластерной плазмы, изменения электронной плотности приводят к изменениям величины заряда углеродных кластеров. При небольшом заряде. графитовые плоскости преобразуются в сфероидальные кластеры. которые объединяются в замкнутые поверхности, в том числе и в фуллерены. При этом процесс слияния термодинамически более выгоден, если кластеры, из которых формируются фуллерены, заряжены. Квантовомеханические расчеты показали, что кластер из атомов углерода расположенных в узлах шестиугольников, может преобразовываться в кластер с пятиугольником, т.е. в сфероидальный кластер, который уже может достраиваться до молекулы фуллерена.

Колебания электронной плотности имеют еще и другой механизм влияния на синтез фуллеренов, который можно считать основным. Действительно, следовые количества фуллеренов наблюдаются при конденсации углеродного пара даже с очень низкой степенью ионизации. Наибольшее процентное содержание фуллеренов в угольном конденсате, полученном плазменным методом, наблюдается при синтезе по методу В. Кретчмера, который отличается от других методов параметрами плазмы, при которых обычно возникает ионизационная неустойчивость, т.е. ионизационные волны. На примере расчета двух путей возможной сборки фуллеренов методами квантовой механики, с учетом классической статистики, было показано, что наиболее эффективно синтез фуллеренов должен идти при возникновении ионизационных волн. В этом случае параметры плазмы с колебаниями электронной плотности будут соответствовать максимальной вероятности образования фуллеренов.

Приведенные выше рассуждения показывают, что имеется реальная возможность синтезировать фуллерены при любых давлениях. Для этого необходимо в остывающей углеродногелиевой плазме осуществлять колебания электронной плотности, например, возбуждением вынужденных ионизационных волн. Это уже реализовано в установке, работающей на частоте тока питающего дугу 10³-10⁵ кГц. При питании разряда током этой частоты отпадает необходимость внешнего воздействия на плазму с целью получения колебаний электронной плотности, так как сам ток разряда осуществляет это воздействие.

Хорошим доказательством правомочности модели формирования фуллеренов и фуллереновых производных можно считать успешный синтез борозамещенного фуллерена, содержание которого в фуллереновой смеси составило величину превосходящую 11%.

В получении результатов, представленных в пунктах 1–5, принимали участие Г.Н.Чурилов, А.С.Федоров. П.В.Новиков; в пункте 6 – Г.Н.Чурилов, А.С. Алиханян, М.И. Никитин, Н.В. Булина, А.Л. Емелина, Г.А. Глущенко, Н.Г.Внукова

Работа выполнена при поддержке фонда INTAS (грант 2399), федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники», при поддержке Российской академии наук (поддержка фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых РАН) и Министерства образования (грант 05.01.001).

- 1. Чурилов Г.Н. К вопросу о переходе углеродной плазмы в фуллереновое состояние углерода: Препринт № 810Ф. – Красноярск: Институт физики СО РАН, 2000. – 18 с.
- G.N. Churilov, P.V. Novikov, V.E., V.A. Lopatin, N.G. Vnukova, N.V. Bulina, S.M. Bachilo, D.Tsyboulski, R.B.Weisman. Electron density as the main parameter influencing the formation of fullerenes in a carbon plasma. // ФТТ. – 2002. – Т.44. – Вып.4. – С.406-409.
- Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.:Наука. 1987. 590с.
- Нерушев О.А., Сухинин Г.И. Кинетика образования фуллеренов при электродуговом испарении графита. // ЖТФ. – 1997. – Т.67. – Вып.2. – С.41-49.
- 5. Афанасьев Д.А., Блинов И., Богданов А. и др. Образование фуллеренов в дуговом разряде. // ЖТФ. –1994. –Т.64. Вып.10. – С. 76-90.
- Kratschmer W., Fostiropoulos K., Huffman D.R. The success in synthesis of macroscopic quantities of C₆₀ // Chem.Phys. Let. – 1990. –V.170. –P.167.
- Афанасьев Д.В., Дюжев Г.А., Каратаев В.И. Влияние заряженных частиц на процесс образования фуллеренов. // ПЖТФ. – 1999. – Т.25. – Вып.5. – С.35-40.
- Недоспасов А.В. Страты. // УФН. 1968. Т.94. Вып.3. С. 439– 462.
- 9. Чурилов Г. Н. Плазменный синтез фуллеренов // Приборы и техника эксперимента. –2000. –№1. –С.5–15.
- И.В. Золотухин, Ю.Е. Калинин, О.В. Стогней Новые направления физического материаловедения. – Воронеж: Издательство Воронежского государственного универистета, 2000. – 360 с.

СОДЕРЖАНИЕ

введе	НИЕ	3
1.	Влияние зарядов углеродных кластеров на процесс образования из них молекулы фуллерена	3
2.	Оценки скорости образования фуллерена С ₆₀ в зависимости от параметров углеродно-гелиевой плазмы	7
3.	Средний заряд частиц в плазме в условиях термодинамического равновесия	8
		10
4.	Сечения столкновений кластеров и вероятность образования фуллеренов	22
5.	Образование эндоэдральных фуллеренов и гетерофуллеренов с учетом заряда кластеров	25 28 30
6.	 Синтез и исследование борозамещенного фуллерена	50
ЗАКЛК СПИС(ЛИТЕР	 ЭЧЕНИЕЭ ЭК РАТУРЫ	

Научное издание

Г.Н. Чурилов, А.С. Федоров, П.В. Новиков, А.С. Алиханян, М.И. Никитин, Г.А. Глущенко, Н.В. Булина, А.Л. Емелина, Н.Г. Внукова

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛ ФУЛЛЕРЕНА И ФУЛЛЕРЕНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ В ИОНИЗИРОВАННОМ УГЛЕРОДНОМ ПАРЕ